



دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشكده مهندسي

ارزیابی ساختار و خواص مغناطیسی فریت نانوساختار نیکل روی تولید شده بهروش تخلیه قوس پلاسما

استاد راهنما دکتر خلیل الله قیصری

استاد مشاور دکتر منصور فربد

نگارنده ابوالفضل صفری

ارديبهشت ماه ٩٤

بسمه تعالى

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده مهندسی

(نتیجه ارزشیابی پایاننامه ارشد)

پایاننامه آقای **ابوالفضل صفری** دانشجوی رشته **مهندسی مواد** گرایش **شناسایی و انتخاب مواد مهندسی** دانشکده **مهندسی** به شماره دانشجویی ۹۱۱۷۴۰۵

با عنوان:

ارزیابی ساختار و خواص مغناطیسی فریت نانوساختار نیکل روی تولید شده بهروش تخلیه قوس پلاسما

جهت اخذ مدرک: کارشناسی ارشد در تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۳۰ توسط هیئت داوران مورد ارزشیابی قرار گرفت و با درجه **عالی** تصویب گردید.

 اعضای هیئت داوران: امضاء رتبه علمي استاديار استاد راهنما: دکتر خلیل الله قیصری استاد مشاور: دکتر منصور فربد دانشيار استاديار استاد داور: دکتر زهره صادقیان استاد داور: **دکتر مرتضی زرگر شوشتری** استاد نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر عزیز عظیمی استاديار ۲. مدیر گروه: دکتر خلیل الله قیصری استاديار **۳**. معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده: دکتر علی حقیقی استاديار استاد **۴.** مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر عبدالرحمن راسخ

دد. تقدیم به بدرومادر عرنزم به پاس تعبیر عظیم وانسانی شان از کلمه ایثار واز خودکذشگان. به پاس عاطفه سر شار و کرمای امید بخش وجود شان که در این سرد ترین روزگاران به شرین پشتیبان است. به پاس قلب بهی بزرکشان که فریادرس است و سرکر دانی و ترس در پنام ثنان به شجاعت می کراید. و به پاس محبت ، می بی در بغثان که هرکز فروکش نمی کند.

سر وقدردانی

به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر انحالق» بسی شایسة است از اساد فرینچته و فرزانه جناب آقای دکتر حلیل اسه قیصری که باکرامتی حون خورشید، سرزمین دل را روشی بخشدند و گلشن سرای علم ودانش را بارا نهایی بهی کار ساز و سازنده بارور ساختند؛ تقدیر و تشکر نایم . تهمچنین از از اساد عزیز، جناب آقای دکتر منصور فربد، که زحمت مثاوره این رساله را درحالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایثان، انجام این پروژه غیر مکن بود، تشکر می نمایم . تهچنین بر خود لازم می دانم از تامی اسانید کروه مهندسی مواد و کروه فیزیک دانشگده علوم، مئولین آ زمایتگاه پای نانو، متاکوکرافی، خورد کی و مواد نوین، مسؤلین کارگاه پای ریخته کری و تراسکاری و تهچنین تامی دوستانی که مراد انجام این پروژه ماری رساندند، شکر وقدردانی نایم.

فهرست مطالب

۱	فصل اول: مقدمه
۱	۱–۱ مقلامه

۴	فصل دوم: مروری بر منابع
۳	۲–۱ تاريخچه
٤	۲-۲ مفاهیم مغناطیسی
٥	۲–۳ انواع مواد مغناطیسی
٦	۲–٤ فریت های مغناطیسی
λ	۲–٤–۱ ساختار بلوری فریت ها
۹	۲–٤–۲ شاخصه های ابعادی در ساختار اسپینل
۱۰	۲–٤–۲ منشاء مغناطش در فریت ها
ی	۲–٤–٤ انواع ساختار اسپينل و نحوه توزيع كاتيون
١٤	۲-٤-۵ رفتار دی الکتریک فریت ها
۱٥	۲-٤-۲ فریت نیکل و فریت نیکل-روی
۱٦	۲-٤-۲ روش های تولید فریت ها
س فريت	۲-٤-۲ مراحل تولید هسته های مغناطیسی از جن
١٨	۲–٥ فرآيند قوس الكتريكي
١٨	۲-۵-۱ تاريخچه قوس الكتريكي
۱۹	۲-۵-۲ معرفي قوس الكتريكي
۲.	۲-۵-۲ پلاسما
۲۱	۲-۵-۲ نحوه برقراری قوس و تولید نانوذرات

۲۳	۲-۵-۵ منابع ايجاد قوس الکتريکي
٢٤	۲-۲ مروری بر پژوهش های انجام شده با روش تخلیه قوس الکتریکی پلاسما

فصل سوم: مواد و روش تحقیق ۴۷
۳۷-۱ تهیه مواد اولیه و آماده سازی
۲-۲ ترکیب پودرها با نسبت مولی معین
۳-۳ تهیه الکترود با استفاده از فرآیند متالورژی پودر۳۸
۳-۶ تولید پودر با روش قوس الکتریکی
۲-۵ متغیرهای در نظر گرفته شده جهت تولید پودر
۳–۵–۱ ارزیابی اثر فشار
۳-۵-۲ ارزیابی اثر اتمسفر
۳-٥-۳ ارزیابی اثر شدت جریان
۳-۵-۶ ارزیابی اثر ترکیب شیمیایی الکترودهای اولیه
۳-۵-۲ ارزیابی اثر عملیات حرارتی
۲-۲ بررسی خواص ٤٦
۳–٦–۱ آنالیز فازی
۲-۳-۲ آنالیز ریزساختاری
۲-۳-۳ بررسی خواص مغناطیسی
۲-۳-۱ بررسی خواص الکترومغناطیس
۳-۳-۵ بررسی خواص الکتریکی

۵۳	فصل چهارم: نتایج و بحث
٥٣	٤-١ تأثير فشار اتمسفر
٥٣	٤-١-١ فشار ١ اتمسفر
۲۵	٤-١-٤ فشار ٢ اتمسفر

٥٨	۲-۱-۲ مقایسه کیفی و کمی فازی نمونه های تهیه شده در فشارهای مختلف
٦١	٤-٢ تأثير اتمسفر
٦١	٤-۲-۱ آنالیز کمی و کیفی فازی نمونه تولید شده در محیط هوا
٦٣	٤-٢-٢ آنالیز کمی و کیفی فازی نمونه تولید شده در محیط آرگون
و آرگون ٦٦	٤-۲-۳ مقایسه آنالیز کمی و کیفی فازی نمونه های تولید شده در محیط هوا، اکسیژن
٦٨	٤-٢-٤ بررسی های ریزساختاری
۷۱	٤-٢-٥ خواص مغناطیسی
۷٥	٤-۲-٦ خواص الكترومغناطيسي
٧٨	٤-٢-٤ خواص الكتريكي
۸۹	٤-٣ تأثير شدت جريان
۸۹	٤–٣–١ آنالیز کمی و کیفی نمونه تولیدی با شدت جریان ۳۰۰ آمپر
۹۱	٤-٣-٢ آنالیز کمی و کیفی نمونه تولیدی با شدت جریان ٤٠٠ آمپر
٩٢	٤-٣-٣ آنالیز کمی و کیفی نمونه تولیدی با شدت جریان ٥٠٠ آمپر
٩٤	٤-٣-٤ مقایسه نمونه های تولیدی در شدت جریانهای ۳۰۰، ٤٠٠ و ۵۰۰ آمپر
٩٦	٤-٤ ارزیابی اثر ترکیب شیمیایی الکترودهای اولیه
٩٦	٤-٤-٤ نسبت مولى (Fe:Ni:Zn , 2:0.5:0.5)
٩٦	۲-٤-٤ نسبت مولى (Fe:Ni:Zn , 2:0.6:0.4)
٩٨	٤-٤-٤ نسبت مولى (Fe:Ni:Zn , 2:0.7:0.3)
۱۰۰.	٤-٤-٤ نسبت مولى (Fe:Ni:Zn , 2:0.8:0.2)
1•7	٤-٤-٥ نسبت مولى (Fe:Ni:Zn , 2:0.9:0.1)
۱۰٥	٤-٤-٤ نسبت مولى (Fe:Ni:Zn , 2:1:0)
۱•۷	٤-٤-٧ مقایسه الگوهای پراش نمونه های تولیدی با نسبت مولی اولیه متفاوت
۱۰۹	٤-٤-٨ بررسی ریزساختار
۱۱۰	٤-٤-٩ بررسی خواص مغناطیسی
110	٤-٥ تأثير عمليات حرارتي

110	٤-٥-١ عملیات حرارتی در دمای C [°] .۱۰۰۰
171	٤-٥-٤ عملیات حرارتی در دمای C [°] .۱۱۰۰
۱ ۲۳	٤-٥-٣ عمليات حرارتي در دماي C °.۱۲۰۰
١٢٨	٤-٥-٤ عملیات حرارتی در دمای C °.۱۲۵۰
۱۳۲	٤-٥-٤ بررسی ریزساختار
١٣٤	٤-٥-٥ بررسي خواص مغناطيسي
١٤٠	٤-٥-٦ خواص الكترومغناطيس
۱٤٣	٤-٥-٧ خواص الكتريكي

107	فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۱٥۲	۵–۱ نتیجه گیری
١٥٤	٥-٢ پيشنهادها

100	مراجع
109	چکیدہ انگلیسی

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱. ماده فرو مغناطیس. الف) در غیاب میدان مغناطیس ب) در حضور یک میدان
مغناطیس قوی
شکل ۲-۲. یک حوزه مربوط به ماده فری مغناطیس
شکل ۲-۳. منحنی مغناطش برای مواد مغناطیسی نرم و سخت۷
شکل ۲-٤. سلول واحد اسپینل۹
شکل ۲-۵. زوایا و فواصل بین یونی در ساختار بلوری اسپینل۹
شکل ۲-۲. دو قطبی شدن دی الکتریک با اعمال میدان الکتریکی
شکل ۲-۷. طرحواره ای از رآکتور فرآیند قوس الکتریکی جهت تولید نانوذرات۲۲
شکل ۲-۸ طرحوارهای از مراحل آزمایش انجام شده توسط سونگ و همکاران۲
شکل ۲-۹. ترکیب بندی مواد خام و نانوذرات تولید شده به روش قوس الکتریکی۲٥
شکل ۲-۱۰. نمایشی از چگونگی برقراری میدان مغناطیسی حول الکترود
شکل ۲-۱۱. مقایسه الگوهای پراش نانوذرات تولیدی در محیط های مختلف۲۷
شکل ۲-۱۲. مقایسه تصاویر SEM مربوط به نمونه های آلیاژ برنج ابتدایی و نانوذرات آلیاژی
تولید شده در محیط آب تقطیر شده۲۷
شکل ۲-۱۳. شماتیکی از فرآیند تخلیه قوس پلاسما جهت تولید نانو ذرات آلیاژی Mn-Al ۲۸
شکل ۲-۱٤. الگوی پراش مربوط به تشکیل نانوذرات NiO
شکل ۲-۱۵. تصویر TEM مربوط به نانوذرات NiO تشکیل شده
شکل ۲-۱3. تأثیر سرعت جریان گاز حامل و فرکانس قوس بر اندازه نانو ذرات۳۰
شکل ۲-۱۷. مقایسه الگوی پراش برای تولید آلیاژ در سه جریان متفاوت۳۱
شکل ۲-۱۸. تصویر SEM برای نمونه با شرایط بهینه حاصل که منجر به تولید نانوذرات با ابعاد
۲۰ نانومتر شده است
شکل ۲-۱۹. حلقه پسماند Fe ₂ O ₃ -α و Fe ₂ O ₃ -Y در دمای اتاق
شکل ۲-۲۰. الگوهای پراش برای نمونه های تولیدی در شرایط مختلف۳۵

شکل ۲-۲۱. تصویر SEM برای نمونه با فشار ا اتمسفر و شدت جریان ۱۰۰ آمپر که منجر به تولید
نانوذرات با میانگین ابعاد ۱۰۰ نانومتر شده است۳۵
شکل ۲-۲۲. حلقه پسماند مربوط به نمونه های تولیدی در شرایط مختلف۳۹
شکل ۳-۱. قالب مورد استفاده جهت تولید الکترود و الکترود تهیه شده توسط آن۳۸
شکل ۳۲-۲. راکتور مورد استفاده در این پژوهش جهت انجام فرآیند قوس الکتریکی۳۹
شکل ۳-۳. دستگاههای مورد استفاده در این پژوهش۳۹
شکل ۳-٤. طرحوارهای از رآکتور فرآیند قوس الکتریکی
شکل ۳-۵. نمونه ای از پودرهای تولید شده قبل و بعد از عملیات حرارتی
شکل ۳-٦. انطباق سازی الگوی پراش محاسباتی با الگوی پراش واقعی
برای نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₅₀
شکل ۳-۷. قالب حلقهای شکل و حلقههای شکل یافته به کمک آن
شکل ۳-۸. حلقههای سیم پیچی شده در این پژوهش با سیم های مسی روکشدار
شکل ۳-۹. الف. دستگاه LCR-meter. ب. قطعه LCR-06
شکل ۲-۱۰. قطعه LCR-09
شکل ۳-۱۱. نمونهی قرصی آغشته به چسب نقره برای ارزیابی رفتار دیالکتریک۵۲
شکل ۲-٤. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀
شکل ۲-٤. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀
شکل ٤-٣. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Nio.5-O1I400 با الگوهای پراش مرجع٥٩
شکل ٤-٤. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -O ₂ I ₄₀₀
شکل ٤-٥. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -O ₂ I ₄₀₀
شکل ٤-٦. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.5} -O ₂ I400 با الگوهای پراش مرجع٥٨
شکل ۲۰. مقایسه الگوهای XRD مربوط به نمونه Ni0.5-O1I400 و نمونه Ni0.5-O2I400
شکل ٤-٨. مقایسه آنالیز کمی نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ و نمونه Ni _{0.5} -O ₂ I ₄₀₀
شکل A-E. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀
شکل ۲۰-٤. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀

شکل ۲۰۱۴. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ با الگوهای پراش مرجع
شكل ۲۴-۱۲ الگوى XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -Ar ₁ I ₄₀₀
شکل ۲۵-۱۳ الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -Ar ₁ I ₄₀₀
شکل ٤-١٤. ميزان تطابق الگوي پراش نمونه Ni _{0.5} -Ar ₁ I ₄₀₀ با الگوهاي پراش مرجع٦٥
شکل ٤-١٥. مقایسه الگوهای XRD مربوط به نمونه های تولید شده با اتمسفر هوا، اکسیژن و
آرگون
شکل ٤-١٦. مقایسه آنالیز کمی نمونه های تولید شده با اتمسفر هوا، اکسیژن و آرگون٦٧
شکل ٤-١٧. طرحواره اي از ذرات اوليه، ذرات ثانويه و کلوخه
شکل ٤-١٨. تصاویر میکروسکوپ FESEM با بزرگنمایی مختلف. الف) نمونه تولیدی در اتمسفر
هوا. ب) نمونه تولیدی در اتمسفر اکسیژن. ج و د) نمونه تولیدی در اتمسفر آرگون۷
شکل ٤-١٩. منحنی پسماند برای نمونه های تولیدی در اتمسفرهای هوا، اکسیژن و آرگون۷۲
شکل ٤-٢٠. بخشی از منحنی پسماند برای نمونه های تولیدی در اتمسفرهای هوا، اکسیژن و
آرگون
شکل ۲۱-٤. تغییرات نفوذپذیری مغناطیسی(µ) بر حسب فرکانس برای نمونه های مختلف۷
شکل ٤-٢٢. تغییرات مقاومت سری سیم پیچ (R) در اثر حضور هسته در بازه فرکانسی ۱۰ ^۲ تا
۱۰ ^۲ هرتز برای نمونه های مختلف۷۷
شکل ٤-٢٣. تغییرات مقاومت سری سیم پیچ (R) در اثر حضور هسته در بازه فرکانسی ۱۰ ^٦ تا
۷۸ هرتز برای نمونه های مختلف.
شکل ٤-٢٤. تغییرات ثابت دی الکتریک حقیقی('٤) بر حسب فرکانس
برای نمونه های Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ و Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀
شکل ٤-٢٥. تغییرات ثابت دي الکتريک حقيقي("٤) بر حسب فرکانس
برای نمونه های Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ و Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀
شکل ٤-٢٦. تغییرات تلفات دی الکتریک (Tan δ) بر حسب فرکانس
برای نمونه های Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ و Ni _{0.5} -O ₁ I _{400.}
شکل ٤-٢٧. تغییرات رسانایی الکتریکی (٥) بر حسب فرکانس

برای نمونه های Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ و Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ ۵۸
شکل ۲۸-٤. تغییرات رسانایی الکتریکی (ac) نمونه های Ni _{0.5} -O ₁ I _{400 و Ni_{0.5}-A₁I_{400 را بهعنوان}}
تابعی از فرکانس۸۹
شکل ٤-٢٩. تغییرات امپدانس موهومی بر حسب امپدانس حقیقی برای
نمونه های Ni _{0.5} -O ₁ L ₄₀₀ و Ni _{0.5} -A ₁ L ₄₀₀
شکل ۲۰۰٤. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₃₀₀
شکل ۲۱-٤. الگوهای مرجع پراش مربوط به نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₃₀₀
شکل ۲-۲۳. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₃₀₀ با الگوهای پراش مرجع۹۱
شكل ۲۳-٤. الگوى XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₅₀₀
شکل ۲٤-٤. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₅₀₀
شکل ٤-٣٥. ميزان تطابق الگوي پراش نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₅₀₀ با الگوهاي پراش مرجع۹۳
شکل ۲ - ۳۳. الگوهای XRD مربوط به نمونه های تولیدی در شدت جریان های ۳۰۰، ٤۰۰ و
۰۰۰ آمپر
شکل ٤-٣٧. مقایسه آنالیز کمی نمونه های تولیدی با شدت جریانهای متفاوت۹٥
شكل XRD. الگوى XRD مربوط بەنمونە Ni _{0.6} -A ₁ I ₄₀₀
شکل ۲۹-۲ الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.6} -A ₁ I ₄₀₀
شکل ۲-۲۰. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.6} -A ₁ I ₄₀₀ با الگوهای پراش مرجع۹۸
شکل ۲-٤. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.7} -A ₁ I ₄₀₀
شکل ۲-٤. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.7} -A ₁ I ₄₀₀
شکل ٤٣-٤. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.7} -A ₁ I400 با الگوهای پراش مرجع
شكل ٤٤-٤. الگوى XRD مربوط بەنمونە Ni _{0.8} -A ₁ L ₄₀₀
شکل ٤-٤٥. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.8} -A ₁ I ₄₀₀
شکل ٤٦-٤. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.8} -A ₁ I400 با الگوهای پراش مرجع
شکل ٤٢-٤. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.9} -A ₁ I ₄₀₀
شکل ٤-٤. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.9} -A ₁ I ₄₀₀

شکل ٤٩-٤. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.9} -A ₁ I ₄₀₀ با الگوهای پراش مرجع۱۰٤
شکل ٤-٥٠. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni ₁ -A ₁ I ₅₀₀
شکل ٤-٥١. الگوهاي مرجع مربوط به XRD نمونه Ni ₁ -A ₁ I ₅₀₀
شکل s-۲۵. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni ₁ -A ₁ I ₄₀₀ با الگوهای پراش مرجع
شکل ٤-٥٣. مقایسه الگوهای XRD مربوط بهنمونه ها با نسبتهای مولی مختلف۱۰۸
شکل ٤-٥٤. مقایسه آنالیز کمی مربوط بهنمونههای تولید شده با نسبت مولی اولیه متفاوت۱۰۸
شكل ٤-٥٥. تصاوير ميكروسكوپ FESEM برای نمونه Ni1-A1I400
شکل ٤-٥٦. مقایسه منحنی پسماند مربوط به نمونه ها با نسبت های مولی مختلف
شکل ٤-٥٧. بخشي از منحني پسماند مربوط به نمونه ها با نسبت هاي مولي مختلف۱۱۲
شکل ٤-٥٨. منحني تغييرات مغناطش اشباع و ميدان پسماند زدا بر حسب نسبت مولي١١٣
شکل ٤-٥٩. وضعیت پر شدن مدار (اوربیتال) لایه ظرفیت یون ها
شکل ٤-٢٠. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -A ₁ L ₄₀₀ T ₁₀₀₀
شکل ٤-٦١. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ T _{1000.}
شکل ۲-۲۶. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni0.5-A1I400T1000 با الگوهای پراش مرجع۱۱۷
شکل ۲۵-۴. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₀₀₀
شکل ٤-٤. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₀₀₀
شکل ٤-٦٥. ميزان تطابق الگوى پراش نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₀₀₀ با الگوهاى پراش مرجع
شکل ۲۵-۲۶. مقایسه الگوی XRD مربوط به نمونه های Ni0.5-A1I400T1000 و
NTN
شکل ٤-٦٧. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₁₀₀
شکل ٤-٦٨. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₁₀₀
شکل ٤-٦٩. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I400T1100 با الگوهای پراش مرجع
شکل ٤-٧٠. الگوی XRD مربوط به نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₀₀
شکل ٤-٧١. الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₀₀
شکل ۲-٤. میزان تطابق الگوی پراش نمونه Ni0.5-A1I400T1200 با الگوهای پراش مرجع

شكل XRD. الگوى XRD مربوط بەنمونە Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₀₀
شکل ۲-٤٪ الگوهای مرجع مربوط به XRD نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₀₀
شکل ٤-٧٥. ميزان تطابق الگوي پراش نمونه Ni _{0.5} -O ₁ L ₄₀₀ T ₁₂₀₀ با الگوهاي پراش مرجع
شكل XRD. الگوى XRD مربوط بەنمونە Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₅₀
شکل ٤-٧٧. الگوهاي مرجع مربوط به XRD نمونه عمليات Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₅₀
شکل Ni0.5-A1I400T1250 یراش نمونه Ni0.5-A1I400T1250 با الگوهای پراش مرجع ۱۳۰
شکل ۲۹-٤. الگوهای XRD نمونه های عملیات حرارتی شده و فاقد عملیات حرارتی ۱۳۱
شکل ٤-٨٠ نمودار آنالیز کمی نمونه های عملیات حرارتی شده و نشده
شكل Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₅₀ نمونه FESEM المونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₅₀
شکل ۲-٤. طیف تفکیک انرژی مربوط بهآنالیز عنصری نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₅₀
شکل ٤-٨٣ منحني پسماند مربوط به نمونه هاي عمليات حرارتي شده و فاقد عمليات حرارتي.
۱۳٥
شکل ٤-٤ بخشی از منحنی پسماند مربوط به نمونه های عملیات حرارتی شده و فاقد عملیات
حرارتی.
شکل ٤-٨٥. نمودار تغییرات مغناطش اشباع بر حسب دمای عملیات حرارتی
شکل ٤-٨٦. نمودار تغییرات مغناطش پسماند و میدان پسماند زدا بر حسب دمای عملیات
حرارتی.
شکل ٤-٨٧. تغییرات دو نمودار مربوط به نیل (خط چین) و مربوط به یافت کیتل(پر رنگ) بر
حسب افزایش فریت روی
شکل ٤-٨٨. تغییرات نفوذپذیری مغناطیسی(µ) بر حسب فرکانس برای نمونه های مختلف۱٤۱
شکل ٤-٨٩. تغییرات فاکتور تلفات (μ / tan δ/μ) بر حسب فرکانس برای نمونه های مختلف۱٤٣
شکل ٤-٩٠. تغییرات ثابت دی الکتریک حقیقی('٤) بر حسب فرکانس
برای نمونههای مختلف
شکل ٤-٩١. تغییرات ثابت دی الکتریک موهومی("٤) بر حسب فرکانس
برای نمونههای مختلف

فهرست جداول

جدول ۲-۱. فواصل بین فضاهای ساختار بلوری اسپینل
جدول ۲-۲. نمونه ای از اسپینل های نرمال، معکوس و مخلوط به همراه مقادیر پارامتر شبکه،
پارامتر موقعیت شبکهٔ اکسیژن و نحوهٔ توزیع کاتیونی
جدول ۲-۳. توزیع کاتیونی گشتاور کل برای فریت نیکل و فریت روی
جدول ۲-٤. پژوهش های پیشین برای تهیه فریت نیکل
جدول ۲-۵. روش های تهیه فریت نیکل-روی در پژوهش های پیشین
جدول ۲-۲. مقایسه اندازه ذرات تولیدی با تغییر پارامترها۳۲
جدول ۲-۷. مقایسه اندازه ذرات تولیدی با تغییر پارامترها۳۲
جدول ۳-۱. مشخصات پودرهای اولیه۳۷
جدول ۳-۲. متغیرهای در نظر گرفته جهت بررسی اثر فشار اتسمفر
جدول ۳-۳. متغیرهای در نظر گرفته جهت بررسی اثر اتمسفر
جدول ۳-٤. متغیرهای در نظر گرفته جهت بررسی اثر شدت جریان
جدول ۳-۵. نسبت مولی عناصر در ترکیب الکترودهای اولیه جهت ایجاد ترکیب های
مختلف فريت نيكل روي
جدول ۳-٦. مشخصات نمونه های تولید شده در اثر فرآیند قوس الکتریکی بههمراه عملیات
حرارتي ثانويه
جدول ٤-١. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ ٥٥
جدول ٤-٢. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.5} -O ₂ I ₄₀₀
جدول ٤-٣. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₄₀₀
جدول ٤-٤. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.5} -Ar ₁ I _{400.}
جدول ٤-٥. اندازه نانوذرات تولیدی در اتمسفرهای مختلف۷۱
جدول ٤-٦. شاخصههای مغناطیسی استنتاج شده از منحنی پسماند
جدول E-۷. مقاومت DC ، مقاومت ویژه الکتریکی DC و چگالی برای نمونه تولیدی در

اتمسفرهای هوا، اکسیژن و آرگون۷۹
جدول R-٤ ثوابت n و A محاسبه شده برای نمونه های مختلف
جدول ٤-٩. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₃₀₀ ۹۱
جدول ٤-١٠. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I ₅₀₀ ۹۳
جدول ٤-١١. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.6} -A ₁ I ₄₀₀ ۹۸
جدول ٤-١٢. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.7} -A ₁ I ₄₀₀
جدول ٤-١٣. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.8} -A ₁ I ₄₀₀
جدول ٤-١٤. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni _{0.9} -A ₁ I ₄₀₀
جدول ٤-١٥. آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک برای نمونه Ni ₁ -A ₁ I ₅₀₀
جدول ٤-١٦. اطلاعات استخراج شده از منحني پسماند نمونه ها
جدول ٤-١٧. نتايج أناليز كمي، پارامتر شبكه و اندازه بلورك نمونه Nio.5-A1I400T1000
جدول ٤-١٨. نتايج آناليز كمي، پارامتر شبكه و اندازه بلورك نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T _{1000.}
جدول ٤-١٩. نتايج آناليز كمي، پارامتر شبكه و اندازه بلورك نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T _{1100.}
جدول ٤-٢٠. نتايج آناليز كمي، پارامتر شبكه و اندازه بلورك نمونه Ni _{0.5} -A ₁ I400T ₁₂₀₀
جدول SI-E. نتایج آنالیز کمی، پارامتر شبکه و اندازه بلورک نمونه Nio.5-O1I400T1200
جدول ٤-٢٢. نتايج آناليز كمي، پارامتر شبكه و اندازه بلورك نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ T ₁₂₅₀
جدول ٤-٢٣. درصد اتمی نظری و محاسبه شده از طیف تفکیک انرژی شکل ٢٣-٤
مربوط به نمونه Ni _{0.5} -O ₁ I400T ₁₂₅₀
جدول ٤-٢٤. اطلاعات استخراج شده از منحني پسماند نمونه ها
جدول ٤-٢٥. اطلاعات مربوط به مغناطش نظري و تجربي نمونه هاي Ni _{0.5} -O ₁ I ₄₀₀ و Ni _{0.5} -
۱۳۹

جدول ۲۵-۲۲. ثوابت n و A محاسبه شده برای نمونه های مختلف به همراه فاکتور انطباق. .. ۱۵۰

علامتها و اختصارها

"

- ینفوذپذیری الکتریکی محیط دیالکتریک
 - گذردھى (نفوذپذيرى) الكتريكى خلأ $arepsilon_0$
 - '*۲* ثابت دیالکتریک حقیقی
 - ثابت دىالكترىك موھومى arepsilon''
 - نفوذپذيرى الكتريكى نسبى \mathcal{E}_r
- شار مغناطیسی گذرنده از سطحمقطع چنبره $\Phi_{_H}$
 - نفوذپذيرى μ
 - نفوذپذیری در خلأ μ_0
 - نفوذپذیری نسبی μ_r
 - مقاومت ویژه ho
 - رسانايى الكتريكى σ

vibrating-sample magnetometer	VSM
Scanning Electron Microscopy	SEM
Field Emission Scanning Electron Microscopy	FESEM